

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成26年11月27日(2014.11.27)

【公開番号】特開2012-160748(P2012-160748A)

【公開日】平成24年8月23日(2012.8.23)

【年通号数】公開・登録公報2012-033

【出願番号】特願2012-73492(P2012-73492)

【国際特許分類】

H 01 L	21/822	(2006.01)
H 01 L	27/04	(2006.01)
H 01 L	29/12	(2006.01)
H 01 L	29/78	(2006.01)
H 01 L	21/336	(2006.01)
H 01 L	29/861	(2006.01)
H 01 L	29/868	(2006.01)
H 01 L	21/329	(2006.01)

【F I】

H 01 L	27/04	C
H 01 L	29/78	6 5 2 T
H 01 L	29/78	6 5 2 K
H 01 L	29/78	6 5 8 F
H 01 L	29/78	3 0 1 B
H 01 L	29/91	F
H 01 L	29/91	D
H 01 L	29/91	B

【誤訳訂正書】

【提出日】平成26年10月10日(2014.10.10)

【誤訳訂正1】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0067

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0067】

図13は、従来の誘電体として窒化ケイ素膜のみを有するコンデンサ(線112)、厚みが30nmの二酸化ケイ素層および厚みが300nmの窒化ケイ素層を有する、本発明の実施形態によるコンデンサ(線110)、厚みが30nmの二酸化ケイ素層および厚み240nmの窒化ケイ素層を有するコンデンサ(線114)、および厚みが350nmの酸窒化ケイ素層を有するコンデンサ(線116)についての、ストレス電圧対平均故障寿命のグラフを示す図である。平均故障寿命は、素子を種々のストレス電圧で試験し、素子の固有の欠陥(すなわち、外因的欠陥による故障以外のすべての故障)の結果として故障寿命の平均を求ることによって導いた。この平均が図13に示すデータ点としてプロットされた。平均故障寿命線は、プロットされた点から外挿された。図13に見られるように、本発明の実施形態によるコンデンサについての平均故障寿命線110は、グラフ上で、従来の窒化ケイ素膜のみの素子についての平均故障寿命線より高いところに移っているだけでなく、従来の窒化ケイ素膜のみの素子についての線より大きな傾斜も有している。したがって、従来の窒化ケイ素膜のみの素子に比べて、本発明を用いる利益が、動作電圧が下がるにつれて増す可能性がある。